

Optische Biometrie und Wellenfront-Aberrometrie für Premium-IOLs - Erste Praxiserfahrungen

Samstag, den 16.06.2012

13:00 bis 14:30 Uhr, Saal Kiew

Dipl.-Ing. Stefan Pieger, Wendelstein

- Neue Nidek-Untersuchungsgeräte für den Kataraktchirurgen – ein kurzer Überblick

Uwe Oberheide, PhD, Köln

- Messung und Dokumentation der Endothelzeldichte mit dem CEM-530 – „Schneller geht nicht“

Dr. med. Omid Kermani, Köln

- Wellenfront-Aberrometrie für Premium-IOL – Grundlagen und Beispiele
- Optische Biometrie mit integrierter Ultraschalleinheit – Erste Erfahrungen und Vergleich zum IOL Master

